# **MEMORY CARD DEVICE**

Patent number:

JP5314019

**Publication date:** 

1993-11-26

Inventor:

YOSHIOKA SHINPEI; KONISHI KAZUO; MARUYAMA

KOJI; MAEKAWA TOMOYUKI; SATO TOSHIAKI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO;; TOSHIBA AVE KK

Classification:

- international:

G06F12/16; G06F3/08; G06K19/07; G11C5/00;

G11C7/00; G11C16/06

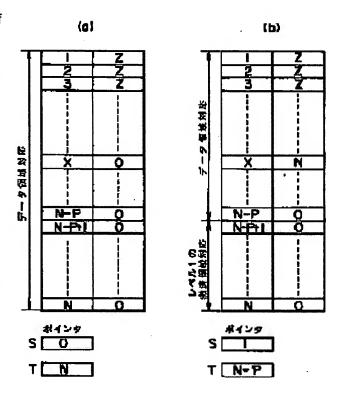
- european:

Application number: JP19920116018 19920508 Priority number(s): JP19920116018 19920508

Report a data error here

# Abstract of JP5314019

PURPOSE:To continuously use even an EPROM in which a write failure occurred at a part of it by retrieving the prescribed number of free blocks from a data area and assigning them to a falure relieving area when the write failure occurs. CONSTITUTION: When the write failure occurs in some block X at the time of writing data in the EPROM, P-pieces of the free blocks in one level portion of a failure relieving level are secured as the failure relieving area. Next, these detected free blocks are assigned to the failure relieving area from the data area. P-pieces of the continuous blocks N, N-1, ..., N-P+1 are changed in their assignment from the data area to the failure relieving area successively from a final block N toward a younger block number, and the failure relieving area of the level '1' is secured. Then, the data to be written in the block X in which the write failure is caused is relieved by writing it in the block N among P-pieces of the secured failure relieving blocks.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平5-314019

(43)公開日 平成5年(1993)11月26日

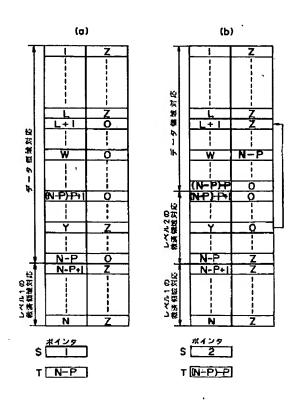
(51)Int.Cl. <sup>5</sup> G 0 6 F 12/16 3/08	識別記号 3 1 0 Q C	庁内整理番号 76295B 71655B	FI.	技術表示箇所
G 0 6 K 19/07		8623-5L	G 0 6 K	19/ 00 N
		6741-5L	G11C	
		V. II. 02		京 請求項の数1(全 9 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平4-116018		(71)出願人	000003078
			,	株式会社東芝
(22)出願日	平成4年(1992)5月8日			神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
			(71)出願人	000221029
				東芝エー・ブイ・イー株式会社
•				東京都港区新橋3丁目3番9号
•			(72)発明者	吉岡 心平
				神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
				式会社東芝映像メディア技術研究所内
			(72)発明者	小西 和夫
			(12)	神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株
				式会社東芝映像メディア技術研究所内
		•	(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦
			(II) (II)	最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 メモリカード装置

## (57)【要約】

【目的】この発明は、一部に書き込み不良が発生したEEPROMでも継続して使用することができるとともに、そのEEPROMの記憶領域の有効利用を図ることができ、経済的に有利で実用に供し得るメモリカード装置を提供することを目的としている。

【構成】EEPROMのデータ領域のブロックに書き込み不良が検出された状態で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索して不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込むデータを不良救済領域の空きブロックに書き込む第1の救済手段と、この不良救済領域が満杯で、かつ、データ領域のブロックに書き込み不良が検出された状態で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索して新たな不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込むデータを新たな不良救済領域の空きブロックに書き込む第2の救済手段とを備えている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一定容量の複数のブロックで構成される データ領域を有するEEPROMと、このEEPROM のデータ領域のブロックに書き込み不良が検出された状 態で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索 「して第1の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに 書き込むデータを前記第1の不良救済領域の空きブロッ クに書き込む第1の救済手段と、この第1の救済手段に より前記第1の不良救済領域が満杯になり、かつ、前記 データ領域のブロックに書き込み不良が検出された状態 10 で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索し て第2の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書 き込むデータを前記第2の不良救済領域の空きブロック に書き込む第2の救済手段とを具備してなることを特徴 とするメモリカード装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、半導体メモリとして EEPROM(エレクトリカリィ・イレーサブル・アン ド・プログラマブル・リード・オンリー・メモリ)を使 20 用したメモリカード装置に係り、特に撮影した被写体の 光学像をデジタル画像データに変換して半導体メモリに 記録する電子スチルカメラ装置等に使用して好適するも のに関する。

#### [0002]

【従来の技術】周知のように、撮影した被写体の光学像 を固体撮像素子を用いて電気的な画像信号に変換し、と の画像信号をデジタル画像データに変換して半導体メモ リに記録する電子スチルカメラ装置が開発されている。 そして、この種の電子スチルカメラ装置にあっては、半 30 導体メモリをカード状のケースに内蔵してなるメモリカ ードを、カメラ本体に着脱自在となるように構成すると とによって、通常のカメラにおけるフィルムと等価な取 り扱いができるようになされている。

【0003】ここで、電子スチルカメラ装置のメモリカ ードは、現在、標準化が進められていて、内蔵される半 導体メモリとしては、複数枚のデジタル画像データを記 録するために大記憶容量のものが要求され、例えばSR AM (スタティック・ランダム・アクセス・メモリ), マスクROM及び電気的にデータの書き込みや消去が可 40 能なEEPROM等が考えられており、SRAMを用い たメモリカードは既に商品化されている。

【0004】ところで、SRAMを用いたメモリカード は、どのようなフォーマットのデータ構成にも対応する ことができるとともに、データの書き込みスピード及び 読み出しスピードも速いという利点がある反面、書き込 んだデータを保持するためのバックアップ電池をメモリ カード内に収容する必要があるため、電池収容スペース を設置する分だけ記憶容量が削減されるとともに、SR

を持っている。

【0005】そこで、現在では、SRAMの持つ問題点 を解消するために、メモリカードに用いられる半導体メ モリとしてEEPROMが注目されている。このEEP ROMは、磁気ディスクに代わる記録媒体として注目を 浴びているもので、データ保持のためのバックアップ電 池が不要であるとともに、チップ自体のコストを安くす ることができる等、SRAMの持たない特有な利点を有 することから、メモリカード用として使用するための開 発が盛んに行なわれている。

【0006】ここで、図6は、SRAMを用いたメモリ カード(SRAMカード)とEEPROMを用いたメモ リカード(EEPROMカード)との長短を比較して示 している。まず、比較項目1,2のバックアップ電池及 びコストについては、既に前述したように、SRAMカ ードはバックアップ電池が必要でありコストも高いとい う問題があるのに対し、EEPROMカードはバックア ップ電池が不要でコストも低くすることができるという 利点を有している。

【0007】次に、比較項目3,4の書き込みスピード 及び読み出しスピードについては、アドレスで任意に指 定したバイトまたはビットに対して、データの書き込み 及び読み出しを行なう、SRAMとEEPROMとに共 通のランダムアクセスモードと、複数の連続するバイト (数百パイト)でなるページを指定することにより、ペ ージ単位で一括してデータの書き込み及び読み出しを行 なう、EEPROMに特有のページモードとに分けて考 えられる。

【0008】そして、ランダムアクセスモードにおい て、SRAMは書き込みスピード及び読み出しスピード が共に速く、EEPROMは書き込みスピード及び読み 出しスピードが共に遅くなっている。また、EEPRO Mは、ページモードにおいて、1ページ分の大量のデー タを一斉に書き込み及び読み出しすることから、ランダ ムアクセスモードに比してデータの書き込みスピード及 び読み出しスピードは速くなっている。

【0009】さらに、比較項目5のイレース(消去)モ ードは、EEPROMに特有のモードであり、SRAM には存在しないモードである。すなわち、EEPROM は、既にデータの書き込まれている領域に新たにデータ を書き込む場合、先に書き込まれているデータを一旦イ レースしないと新たなデータを書き込むことができない ため、データの書き込みを行なうに際して、このイレー スモードが実行されるようになっている。

【0010】また、比較項目6の書き込みベリファイ も、EEPROMに特有のモードであり、SRAMには 存在しないモードである。すなわち、EEPROMは、 データ書き込みを行なう場合、通常1回の書き込み動作 では完全な書き込みが行なわれない。このため、EEP AM自体のコストが高く経済的な不利を招くという問題 50 ROMに対して1回の書き込み動作を行なう毎にEFP

₹

ROMの書き込み内容を読み出し、正確に書き込まれているか否かをチェックする必要があり、これが書き込みベリファイである。

【0011】具体的には、EEPROMに書き込むべきデータをバッファメモリに記録しておき、バッファメモリからEEPROMにデータを転送して書き込んだ後、EEPROMの書き込み内容を読み出し、バッファメモリの内容と比較して一致しているか否かを判別している。そして、書き込みベリファイの結果、不一致(エラー)と判定された場合には、再度バッファメモリの内容 10をEEPROMに書き込む動作を繰り返すようにしている。

【0012】以上の比較結果から明らかなように、EEPROMには、バックアップ電池が不要でありコストが安く、しかもページ単位のデータ書き込み及び読み出しが可能である等の、SRAMに見られない特有な利点が備えられている反面、ランダムアクセスモードにおけるデータの書き込みスピード及び読み出しスピードが遅いとともに、イレースモードや書き込みベリファイ等のようなSRAMにはないモードを必要とするという不都合20もある。

【0013】そこで、メモリカードに使用する半導体メモリとして、現在使用されているSRAMに代えてEEPROMを使用することを考えた場合、データの書き込みスピード及び読み出しスピードの問題や、イレースモード及び書き込みベリファイ等を必要とするという問題を解消し、SRAMを内蔵したメモリカードと等価な取り扱い方ができるように、つまりSRAMカードライクに使用できるように細部に渡って種々の改良を施すことが、肝要なこととなっている。

【0014】この場合、特に問題となることは、EEPROMは、データの書き替え回数が一定数を越えるとメモリセルが急激に劣化しデータの書き込み不良が発生し易くなることである。すなわち、EEPROMは、プログラムデータの記録用として開発され、プログラムのバージョンアップのときにデータの書き替えを行なえるようにすることを意図したものであるから、多数回のデータ書き替えに対応できるように設計されていないからである

【0015】ところが、上述したように、例えば電子ス 40 チルカメラ装置等に使用されるメモリカード用の半導体 メモリとして、従来より使用されていたSRAMに代え てEEPROMを用いるようにした場合、当然のことな がら、EEPROMに対して頻繁にデータの書き替えが 行なわれるような使われ方をされることになるため、書き込み不良の発生率が飛躍的に増大するであろうこと は、どうしても避けられないこととなっている。

【0016】そして、との書き込み不良について、従来では、前述した書き込みベリファイ処理を所定回数繰り返しても正しく書き込まれなかったとき書き込み不良で50

あると判断している。しかるに、従来では、EEPRO Mの一部に書き込み不良が生じた場合でも、そのEEP ROMを内蔵するメモリカード全体を不良品として取り 扱うようにしているため、非常に効率が悪く経済的に不 利であるという問題が生じている。

#### [0017]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、EEPROMを内蔵した従来のメモリカードでは、一部に書き込み不良が発生したEEPROMを内蔵するメモリカード全体を不良品として処理するため、非常に効率が悪く経済的に不利になるという問題を有している。

【0018】そこで、この発明は上記事情を考慮してなされたもので、一部に書き込み不良が発生したEEPR OMでも継続して使用することができるとともに、その EEPROMの記憶領域の有効利用を図ることができ、 経済的に有利で実用に供し得る極めて良好なメモリカー ド装置を提供することを目的とする。

#### [0019]

【課題を解決するための手段】この発明に係るメモリカ 20 ード装置は、一定容量の複数のブロックで構成されるデータ領域を有するEEPROMと、このEEPROMのデータ領域のブロックに書き込み不良が検出された状態で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索して第1の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込む第1の救済手段と、この第1の救済手段により第1の不良救済領域が満杯になり、かつ、データ領域のブロックに書き込み不良が検出された状態で、該データ領域中から規定数の空きブロックを検索して第2の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込むデータを第2の不良救済領域の空きブロックに書き込む第2の救済手段とを備えるようにしたものである。

#### [0020]

【作用】上記のような構成によれば、第1の救済手段により、データ領域の一部のブロックに書き込み不良が発生したとき、データ領域中から規定数の空きブロックを検索して第1の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込むようにしたので、一部に書き込み不良が発生したEEPROMでも継続して使用することができ、経済的に有利で実用に適するものである。また、第1の不良救済領域が満杯になった場合には、第2の救済手段により、データ領域中から新たに規定数の空きブロックを検索して第2の不良救済領域に割り当て、該不良ブロックに書き込むデータを第2の不良救済領域の空きブロックに書き込むようにしたので、EEPROMの記憶領域の有効利用を図ることができる。

#### [0021]

【実施例】以下、この発明を電子スチルカメラ装置に適 用した場合の一実施例について図面を参照して詳細に説 明する。図1において、11はメモリカード本体で、そ の一端部に設置されたコネクタ12を介して、図示しな い電子スチルカメラ本体に接続されるようになされてい る。このコネクタ12には、電子スチルカメラ本体側か ら、メモリカード本体 1 1 に書き込むべきデータや、そ の書き込み場所を示すアドレスデータ等が供給される。 【0022】そして、とのコネクタ12に供給されたデ ータは、バスライン13を介してデータ入出力制御回路 14に取り込まれる。このデータ入出力制御回路14 は、データの高速書き込み及び高速読み出しが可能な図 10 示しないバッファメモリを内蔵しており、取り込んだデ ータを一旦バッファメモリに記録する。その後、データ 入出力制御回路14は、バッファメモリに記録したデー タを、バスライン15を介して複数(図示の場合は4 つ) のEEPROM 16の書き込みサイクルに対応した タイミングで読み出し、EEPROM16に記録する。 【0023】この場合、データ入出力制御回路14は、 EEPROM16に例えばページ単位でデータが書き込 まれる毎に、EEPROM16から書き込んだページ単 位のデータを読み出し、バッファメモリに記録されてい 20 るデータと一致しているか否かを判別する書き込みベリ ファイを実行する。そして、データ入出力制御回路14 は、EEPROM16から読み出したデータと、バッフ ァメモリに記録されたデータとが一致していない場合、 再度、パッファメモリからEEPROM16にデータを 転送して書き込みを行なわせ、この動作が所定回数繰り 返される間に、EEPROM16から読み出したデータ とバッファメモリに記録されたデータとが完全に一致し

【0024】次に、EEPROM16から、データをメモリカード本体11の外部に読み出す場合には、電子スチルカメラ本体側からコネクタ12を介して読み出すべきデータを指定するアドレスがデータ入出力制御回路14に供給される。すると、データ入出力制御回路14は、入力されたアドレスに基づいてEEPROM16からデータを読み出し、一旦バッファメモリに記録する。その後、データ入出力制御回路14は、バッファメモリに記録したデータを読み出しコネクタ12を介して外部に導出し、ことにデータの読み出しが行なわれる。

たとき、データの書き込みが完了される。

【0025】したがって、上記のような構成によれば、電子スチルカメラ本体とメモリカード本体11との間におけるデータ転送は、必ずパッファメモリを介して行なわれるので、電子スチルカメラ本体側から見たメモリカード本体11へのデータの書き込みスピード及び読み出しスピードを向上させることができる。また、EEPROM16に特有の書き込みベリファイも、バッファメモリを用いてメモリカード本体11の内部で自動的に処理されるので、メモリカード本体11の取り扱いとしては、全くSRAMカードライクに使用することができる。

【0026】 CCで、上記EEPROM16は、図2に 示すように、0000~XXXXX番地よりなる記憶領域 を有しており、この記憶領域は、データを扱う際の最小 単位である一定容量の複数のブロック1~N(1ブロッ クは通常数kバイト)に分割されている。このブロック 1~Nの全てが、通常のデータを記録するデータ領域と なっている。このデータ領域は、メモリカード本体11 の外部から直接アクセスすることが可能であり、コネク タ12を介して直接アドレスを指定することによって、 数百パイトでなるページ単位のデータ書き込み及び読み 出しを繰り返すことにより、自由にブロック単位でのデ ータ書き込み及び読み出しを行なうことができる。 [0027] また、EEPROM16内には、図3 (a) に示すような、上記各ブロックの管理テーブル と、2つのポインタS、Tとが設けられている。すなわ ち、この管理テーブルは、図中左列がプロック番号1~ Nを示し、図中右列がそのブロックの状態を示してい る。すなわち、"O"はそのブロックが未使用であると とを示し、"Z(1~N以外の数値)"はそのブロック が使用中であることを示している。また、そのブロック が書き込み不良であると判断された場合には、そのブロ ックに書き込むべきデータを他のブロックに書き込んで

救済する処置がとられるが、そのときの救済先のブロック番号が書き込まれる。例えば管理テーブルのブロック

番号Aに対応する位置に数値Bが書き込まれていれば、

そのブロックAが書き込み不良で、そのブロックAに書

き込むべきデータがブロックBに書き込まれて救済され

ていることを意味している。 【0028】さらに、上記ポインタSは、不良救済レベ ルを示し、初期状態つまり書き込み不良の救済を1つも 行なっていない状態では"0"となっている。この不良 救済レベルの最大値は、あらかじめ設定されており、こ の実施例では"M"とする。また、上記ポインタTは、 電子スチルカメラ本体側からメモリカード本体11の残 り記録容量を検知するためのもので、初期状態つまり書 き込み不良の救済を1つも行なっていない状態では、全 ブロック 1 ~Nがデータ領域であるため "N" となって いる。各ブロック1~Nに対するデータの書き込みは、 ブロック番号の若いブロックから極力前づめで行なわれ るが、不要データを消去したりその後のデータ書き込み 等が行なわれることにより、一時的に連続する使用中ブ ロックの間に未使用ブロックが発生する場合もある。 【0029】 ここで、EEPROM16へのデータ書き 込み時に、あるブロックXに書き込み不良が発生した場 合、データ入出力制御回路 1 4 は、まず、ポインタSの 内容を見て不良救済レベルが最大値Mになっているか否 かを判別する。との判別は、発生した書き込み不良が、

書き込みの繰り返しによるメモリセルの劣化によって生

じたものか、例えば半田付け不良やチップ全体の不良等

50 によるものかを区別するために行なっている。また、メ

(5)

モリセル不良の累積であっても磨耗不良領域に入った場 合は、信頼性の点から使用を停止することが望ましい。 【0030】そして、不良救済レベルが最大値Mになっ ていなければ、データ入出力制御回路14は、不良救済 レベルを1段階アップさせるために未使用のつまり空き ブロックの検索を行なう。不良救済レベルの1レベル分 とは、P個の空きブロックを不良救済領域として確保す ることを意味する。そして、1レベル分の空きブロック がない場合には、データ入出力制御回路14は、これ以 上の処理を中止し、そのメモリカード本体11の使用を 10 禁止する。このため、このメモリカード本体11を継続 して使用したい場合には、使用者は、不要データを消去 することにより1レベル分の空きブロックが確保できる ようにする必要がある。

【0031】ここで、1ブロック分の空きブロックが検 出されると、データ入出力制御回路14は、この検出さ れた空きブロックをデータ領域から不良救済領域に割り 当てる。この割り当てに際しては、電子スチルカメラ本 体側から見たアドレスの連続性を確保するために、図3 (b) に示すように、最終プロックNから順次若いプロ 20 ック番号に向かって連続するP個のブロックN、N-1, ……, N-P+1が、データ領域から不良救済領域 に割り当てを変更され、ここに、レベル1の不良救済領 域が確保される。とのとき、データ入出力制御回路14 は、この割り当ての変更を電子スチルカメラ本体側に知 らせるために、ポインタTの内容を従来の"N"から "N-P" に変更する。また、データ入出力制御回路1 4は、不良救済レベルが1段階アップしたことを示すた めに、ポインタSの内容を+1する。

【0032】とのようにしてP個の不良救済ブロックが 30 確保されると、データ入出力制御回路14は、実際の不 良救済処理を実行する。実際に図3(b)では、書き込 み不良の発生したブロックXに書き込むべきデータを、 先に確保したP個の不良救済ブロックのうちのブロック Nに書き込んで救済した例を示している。そして、不良 救済処理後、データ入出力制御回路 1 4 は、図 3 (b) に示す管理テーブルのブロックXに対応する図中右側 に、救済先のブロック番号"N"を書き込み、ブロック Nに対応する図中右側に、使用中であることを示す数値 "乙"を書き込んで、ここに、書き込み不良ブロックX 40 の救済処理が完了される。

【0033】次に、上記のようにしてEEPROM16 に書き込まれたデータを電子スチルカメラ本体側に読み 出す場合、まず、電子スチルカメラ本体は、ポインタT の内容を見てメモリカード本体 1 1 の残り記録容量、つ まりデータ領域として利用できるブロックの数が "N-P"であることを検知する。このため、救済領域として 利用されるP個のブロックN-P+1~Nは、電子スチ ルカメラ本体側からは隠れた存在となる。そして、電子 スチルカメラ本体からブロックXのデータ読み出しが要 50 は、図3に示したレベル1の不良救済処理の説明に準じ

求されると、データ入出力制御回路14は、図3(b) に示す管理テーブルからブロックXに書き込むべきデー タがブロックNに救済されていることを検知し、ブロッ クNに書き込まれたデータを読み出して電子スチルカメ ラ本体に出力する。このため、電子スチルカメラ本体側 には、EEPROM16に書き込み不良が発生したこと を何ら認識させることなく、メモリカード本体11に対 するデータの書き込み及び読み出しを行なうことができ

【0034】 ここで、図4(a) に示すように、レベル 1の不良救済領域の各ブロックN-P+1~Nが満杯つ まり全て不良救済に使用された状態で、データ領域のブ ロック♥に書き込み不良が発生した場合には、データ入 出力制御回路14は、上記と同様にデータ領域の中の最 終ブロックN-Pから順次若いブロック番号に向かって 連続するP個のブロックN-P, N-P-1, ……, (N-P)-P+1を、データ領域から不良救済領域に

割り当てを変更して、図4(b)に示すようにレベル2 の不良救済領域を確保する。

【0035】とのとき、新たに不良救済領域に割り当て られたP個のブロックN-P, N-P-1, ……, (N -P) -P+1の中の、ブロックYが使用中であった場 合、データ入出力制御回路 1 4 は、ブロック Y に書き込 まれているデータを、データ領域の中で最も若い空きブ ロックL+1に移動し、管理テーブルのブロックL+1 に対応する図中右側に、使用中であることを示す数値 "Z"を書き込むとともに、ブロックYに対応する図中 右側に、未使用であることを示す数値"〇"を書き込 む。そして、データ入出力制御回路14は、この新たな 不良救済領域が作成されたことによる割り当ての変更を 電子スチルカメラ本体側に知らせるために、ポインタT の内容を従来の"N-P"から"(N-P)-P"に変 更する。また、データ入出力制御回路14は、不良救済 レベルがさらに1段階アップしたことを示すために、ポ インタSの内容を+1する。

【0036】このようにしてレベル2の不良救済領域が 確保されると、データ入出力制御回路 1 4 は、実際の不 良救済処理を実行する。実際に図4(b)では、書き込 み不良の発生したブロックWに書き込むべきデータを、 先に確保したP個の不良救済ブロックのうちのブロック N-Pに書き込んで救済した例を示している。そして、 不良救済処理後、データ入出力制御回路14は、図4 (b) に示す管理テーブルのブロックWに対応する図中 右側に、救済先のブロック番号"N-P"を書き込み、 ブロックN-Pに対応する図中右側に、使用中であると とを示す数値"乙"を書き込んで、ことに、書き込み不 良ブロックWの救済処置が完了される。

【0037】なお、電子スチルカメラ本体側からブロッ ク♥のデータ読み出しが要求された場合の動作について て、容易に窺い知れるところであるので、その説明を省 略する。

【0038】 ことで、図5は、以上の動作をまとめたフローチャートを示している。まず、データ入出力制御回路14は、いずれかのブロックに書き込み不良が発生したことを検出すると(ステップS1)、ステップS2で、不良救済領域が形成されているか否か、つまり、ポインタSが"0"か否かを判別し、ある場合(YES)には、ステップS3で、その救済領域に空きブロックがあるか否かを判別する。そして、空きブロックがあれば10(YES)、データ入出力制御回路14は、ステップS4で、その空きブロックを利用して不良救済処理を行ない、終了(ステップS5)される。

【0039】また、ステップS2で不良救済領域が形成されていない(NO)、またはステップS3で空きブロックがない(NO)と判断された場合、データ入出力制御回路14は、ステップS6で、不良救済レベルが最大値になっているか否か、つまり、ポインタSの内容が

"M"か否かを判別し、最大値であれば(YES)、ステップS7で、このメモリカード本体11はこれ以上使 20 用不可と判断して、終了(ステップS8)される。一方、不良救済レベルが最大値になっていない(NO)と判断された場合、データ入出力制御回路14は、ステップS9で、現在のデータ領域内に1レベル分の不良救済領域を形成するためのP個の空きブロックがあるか否かを判別し、ない(NO)場合、ステップS7で、このメモリカード本体11はこれ以上使用不可と判断して、終了(ステップS8)される。

【0040】そして、1レベル分の空きブロックがある(YES)と判断された場合、データ入出力制御回路14は、ステップS10で、現在のデータ領域中の最終ブロックから順次若いブロック番号に向かって連続してP個の空きブロックを確保できるか否かを判別し、確保できない(NO)場合、ステップS11で、確保すべき領域内に書き込まれているデータを、その確保すべき領域外のデータ領域に移動させた後、ステップS12で、その移動させたデータに関連する情報の書き替え等の処理を実行する。

【0041】 ここで、ステップS10でP個の空きプロックを連続して確保できる(YES)と判断された場合、またはステップS12で関連情報の書き替えが行なわれた後、データ入出力制御回路14は、ステップS13で、確保した領域をデータ領域から不良救済領域に割り当て変更し、ステップS14で、ボインタS, Tの内容を更新させた後、ステップS4で、不良救済処理を行ない、終了(ステップS5)される。

【0042】したがって、上記実施例のような構成によれば、データ領域の一部のブロックに書き込み不良が発生したとき、データ領域中からP個の空きブロックを検索して不良救済領域に割り当て、この不良救済領域の空 50

きブロックに該不良ブロックに書き込むべきデータを書き込むようにしたので、一部に書き込み不良が発生した EEPROM16でも継続して使用することができ、経済的に有利で実用に適するものである。また、不良救済領域が満杯になった場合には、データ領域中から新たにP個の空きブロックを検索して第2の不良救済領域に割り当て、この第2の不良救済領域の空きブロックに該不良ブロックに書き込むべきデータを書き込むようにしている、つまり、書き込み不良ブロックの発生量に応じて不良救済領域をP個のブロック単位で増加させるようにしているので、EEPROM16の記憶領域の有効利用を図ることができる。

【0043】さらに、上記実施例によれば、EEPRO M16のデータ領域は、書き込み不良ブロックの発生量に応じて自動的に削減されるため、見掛上残り記録容量があるにもかかわらずデータを記録することができないという問題は生じない。また、データ領域の削減は、例えば初期状態で4MバイトのEEPROM16であれば、3Mバイト、2Mバイト、1Mバイト、512kバイト、256kバイトのように切りの良い値で順次行なうようにしてもよい。これは、通常のメモリカードのラインナップ系列に合わせることができ、外部からの認識を容易にすることができるとともに、残り記録容量を量子化して出力(例えば256kバイトのN倍等)する際にも好適である。

【0044】 ここで、上記実施例では、書き込み不良が発生したとき、P個の空きブロックによる不良救済領域を生成し、この不良救済領域が満杯になった場合、再度P個の空きブロックによる不良救済領域を生成するようにしたが、不良救済領域を構成する空きブロックの数は、常に同じP個に限らず、不良救済領域を構成する毎に異ならせてもよいことはもちろんである。なお、この発明は上記各実施例に限定されるものではなく、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。

### [0045]

【発明の効果】以上詳述したようにこの発明によれば、一部に書き込み不良が発生したEEPROMでも継続して使用することができるとともに、そのEEPROMの記憶領域の有効利用を図ることができ、経済的に有利で実用に供し得る極めて良好なメモリカード装置を提供することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係るメモリカード装置の一実施例を 示すブロック構成図。

【図2】同実施例におけるEEPROMの記憶領域を示す図。

【図3】同実施例における管理テーブルの詳細を示す 図。

| 【図4】同実施例で救済領域が満杯になった場合の対策

11

を示す図。

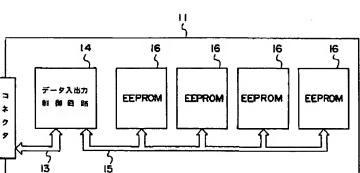
12~

【図5】同実施例の動作をまとめたフローチャート。 【図6】SRAMカードとEEPROMカードとの長短 を比較して示す図。

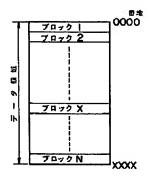
# \*【符号の説明】

11…メモリカード本体、12…コネクタ、13…バス ライン、14…データ入出力制御回路、15…パスライ ン、16…EEPROM。

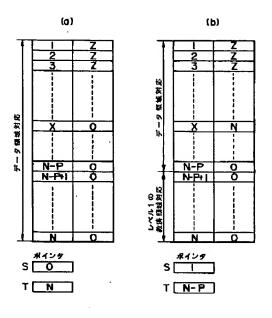
【図1】



[図2]

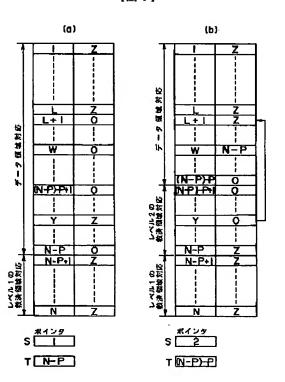


[図3]

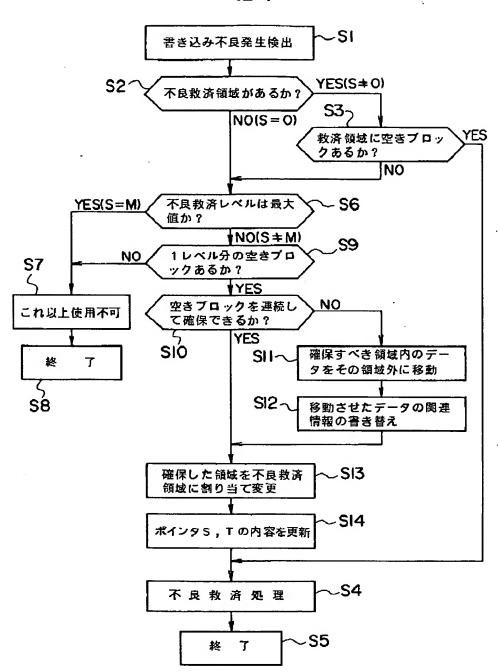


١.

【図4】



[図5]



【図6】

比 較 項 目	SRAM カード	EEPROM カード
1. バックアップ電池	有	無
<ol> <li>コスト</li> <li>書き込みスピード(ランダム) (ページ)</li> </ol>	高 速 —————	やや低 遅 <b>や</b> や速
4. 読み出しスピード(ランダム) (ページ)	速 	遅やや速
5. イレースモード 6. 費き込みベリファイ	無 必 要 <del>無</del>	有 必要有

フロントページの続き

(51) Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 G 1 1 C 5/00 302 Z 6741-5L 7/00

3 1 5 6741-5L

16/06

(72)発明者 丸山 晃司

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝映像メディア技術研究所内

(72)発明者 前川 智之

FΙ

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 式会社東芝映像メディア技術研究所内

技術表示箇所

(72)発明者 佐藤 聡明

東京都港区新橋3丁目3番9号 東芝エ ー・ブイ・イー株式会社内